

Załącznik nr 1

Analogowo cyfrowa karata pomiarowa dla systemu rozwojowego - 1 sztuka

Karta ewaluacyjna analogowo-cyfrowa 8-kanalowa, 24-bitowa z równoległym pobieraniem próbek opierająca się na układzie AD7779, częstotliwość próbkowania 16 kSPS na kanał, typ przetwornika ADC Sigma-Delta ze skalowaniem mocy, programowalny, wzmacnienie wzmacniacza (PGA) na kanał (1, 2, 4 i 8), sterowanie za pomocą PC w połączeniu z płytą kontrolną EVAL-SPD-CH1Z.

Analogowo cyfrowa karata pomiarowa dla systemu rozwojowego - 1 sztuka

Karta ewaluacyjna analogowo-cyfrowa 8-kanalowa, 24-bitowa z równoległym pobieraniem próbek opierająca się na układzie AD7768, częstotliwość próbkowania 256 kSPS na kanał, typ przetwornika ADC Sigma-Delta ze skalowaniem mocy, sterowanie za pomocą PC w połączeniu z płytą kontrolną EVAL-SPD-CH1Z, platforma demonstracyjna systemu (EVAL-SDP-CH1Z)

Płyta szybkiego kontrolera dla systemu rozwojowego - 2 sztuki

Płyta oparta na układzie Xilinx® Spartan 6, 1 x złącze FMC Low Pin Count (LPC), rodzaj pamięci DDR2, złącze JTAG, procesor Blackfin ADSP-BF527, 1 x małe 120-stykowe złącze Footprint, konfigurowalne interfejsy peryferyjne SPI, SPORT, I2C, GPIO, równoległe asynchroniczne, PPI, Timery, interfejs USB 2.0 do komunikacji z komputerem, kompatybilność z kartami pomiarowymi EVAL-AD7768, EVAL-AD7779